

分析評価サービス

弊社の分析評価サービスは、私どもが長年培ってきた高度な技術で各種分析機器を駆使し、原因究明はもとより、製造プロセスまで踏み込んだ故障解析を行い、改善施策をリーズナブルな価格でご提供致します。

表面分析

形態観察

故障解析を行いたいが、どこに
コンタクトしたらよいか判らない。

メーカー故障解析結果の妥当性を検証したい。

熱物性

海外の部品メーカーが迅速に故障解析を
してくれず、改善が進まない。

メーカー部品故障解析のリードタイムが長く
お客様報告に間に合わない。

自社プロセスの歩留まり改善の為、
不良原因を調べたい。

化合物

社外分析機関に分析依頼したが、
思っていたデータが取れない。

クロマトグラフ 分析

RoHS 対応分析

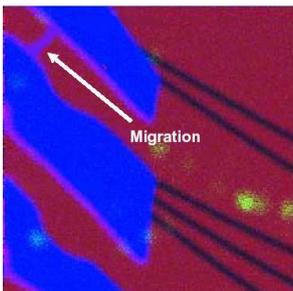
スクリーニングから
高感度詳細調査まで

機械的 強度解析

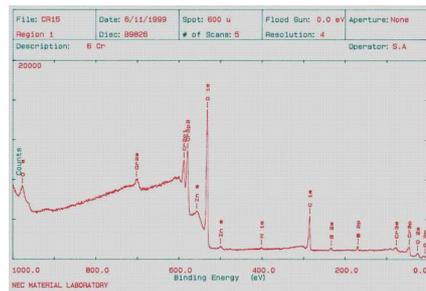
環境試験

表面分析

WDX、EDX、AES、 μ -ESCA、X線分析顕微鏡等の
設備を用いて、様々な固体の表面層の分析を行います。



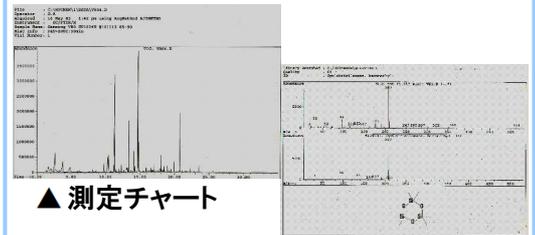
▲ X線透視像



▲ μ -ESCA 状態分析

クロマトグラフ分析

GC-MS、IC 等の設備を用い、有機ガス
分析を行います。腐食性・揮発性ガスの
分析、環境調査等が可能です。

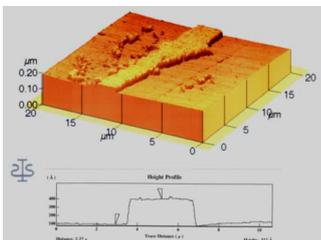


▲ 測定チャート

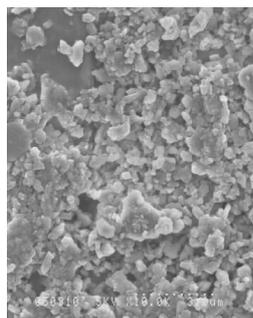
▲ 解析チャート

形態観察

FE-SEM、SEM、AFM 等の設備を用いて、
様々な固体の表面形態分析を行います。



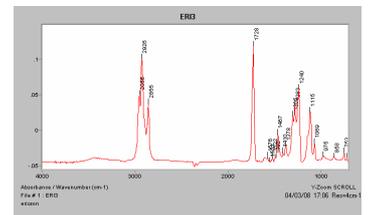
◀ AFM 像



▲ SEM 像

化合物分析

FT-IR 等の設備を用いて、
物質の有機成分分析が可能です。



▲ FT-IR チャート

表面分析	電子線マイクロアナライザー分析(波長分散型X線分光分析・WDX)
	電解放射型電子顕微鏡(エネルギー分散型 X 線分光分析・EDX)
	X 線光電子分光分析(μ -ESCA)
形態観察	電解放射型電子顕微鏡(FE-SEM)
	走査型電子顕微鏡(SEM)
	原子間力顕微鏡(AFM)
熱物性	熱重量・示差熱分析(TG/DTA)
	熱機械分析(TMA)
	示差走査熱分析(DSC)
クロマトグラフ分析	ガスクロマトグラフ(GC)
	ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)
化合物解析	イオンクロマトグラフ(IC)
	フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR)
機械的強度解析	引張り試験機
	硬さ測定
環境試験	高温高湿試験
	熱衝撃試験
	腐食試験
非破壊検査	X 線透視装置
その他	埋没法断面観察
	紫外可視分光光度計

分析設備

Equipment



EDX エネルギー分散型 X 線分析装置
・微小部分の元素分析
SEM 高分解能走査型電子顕微鏡
・断面微細構造観察
・表面微細構造観察



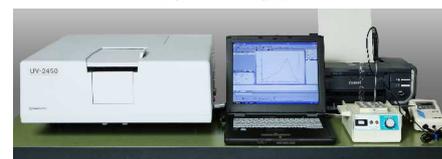
FT-IR フーリエ変換赤外分光光度計
・有機物の分析



蛍光 X 線分析装置 ▼



イオンクロマト イオンクロマトグラフ装置
・純水/空気中のイオン分析



紫外可視分光光度計 ▼



GC-MS ガスクロマトグラフィー・質量分析装置
・有機溶剤成分分析
・加熱発生ガス分析



X線透視装置
・電子部品内部不良検査
・高密度実装基板の検査



EPMA X線マイクロアナライザー
・微小部分の元素分析
・異物分析



AFM 原子間力顕微鏡
・微細表面形状解析

- 本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。
- 本カタログの写真と実際の製品では一部異なる場合があります。また、内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。

お問い合わせは下記へ

三映電子工業株式会社
〒385-0002 長野県佐久市上平尾 801
Tel. 0267-78-5010 Fax. 0267-78-5011
E-mail info@sanei-j.com URL http://www.sanei-j.com/
東京営業 Tel. 03-5999-8801(代) Fax. 03-5999-8807

SAN-EI
三映電子工業株式会社